PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-305917

(43) Date of publication of application: 28.10.1992

(51)Int.CI.

H01L 21/027

(21)Application number: 03-094863

(71)Applicant: NIKON CORP

(22)Date of filing: 02.04.1991 (72)Inventor: OZEKI HISAO

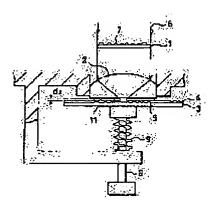
MATSUBARA TAKASHI

(54) ADHESION TYPE EXPOSURE DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To thin film thickness of an immersion liquid and reduce the quantity of light absorbed, and to minimize and prevent exposure unevenness in an adhesion type exposure device.

CONSTITUTION: The adhesive surface 11 of an exposure lens is hydrophilic-treated by a hydrophilic solution such as alcohol. A wafer 3 coated with a photoresist 4 is fast stuck on the hydrophilic-treated adhesive surface 11 through an immersion liquid 5, and the pattern 7 of a photomask 1 is transferred onto the wafer 3 by the irradiation of irradiation light 6. Wafer absorbing properties are improved in the hydrophilic-treated adhesive surface 11, and the film thickness of the immersion liquid 5 is made thin.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

(19)日本国特許庁 (JP)

J.

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平4-305917

(43)公問日 平成4年(1982)10月28日

(51) Int.Cl. ⁵ H 0 1 L 21/027	綠則配号	庁內整理番号	F J		技術表示箇所
		7019—4 <u>M</u> 7352—4M	H01L 21/30	341 S 311 A	

審査請求 未薪漆 薪求項の数1(全 3 頁)

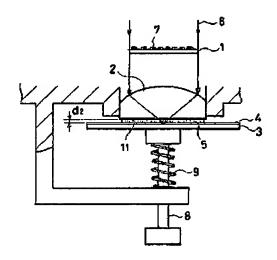
(21) 出題番号	特頭平3-94863	(71)出頃人 000004112 株式会社ニコン
(22) 出題日	平成3年(1991)4月2日	東京客千代田区丸の内3丁目2番3号
		(72) 発明者 大関 尚夫 東京都品川区西大井一丁目6番3号 株式
		会社ニコン大非異作所内
		(72)発明者 松原 隆 東京都品川区西大井一丁目6番3号 株式 会社ニコン大弁製作所内
		(74)代理人 弁理士 山川 政樹

(54) 【発明の名称】 密着型質光接置

(57) 【張約】

【目的】 密着型風光装置において、浸液の膜厚を薄く して光の吸収量を少なくし、露光ムラを軽減防止するこ とを目的とする。

【樹成】 超光レンズの密着面11をアルコール等の親 水溶液によって親水化処理する。この親水化処理された 密着面11にフォトレジスト4を塗布されたウエハ3を 起被5を介して密着させ、照射光6の原射によりフォト マスク1のパターン7をウエハ3上に転写する。親水化 処理された密着面11は、吸水性が向上し、浸液5の膜 厚を薄くする。



(2)

特開平4-305917

【特許請求の範囲】

【餅求項1】 投影光学系もしくはフォトマスクのウエ 八密着面を弱水化処理し、この親水化処理された密着面 にフォトレジストを固有されたウエハを浸液を介して密 着させ、照射光の照射によりフォトマスクのパターンを 前紀フォトレジストに転写するようにしたことを特徴と する密着型器光装団。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、LSIの製造工程にお 10 いて、フォトマスク上のパターンをウエハ上に投影席光 する母光表記、特に密着型露光被置に関するものであ る。

[0002]

【従来の技術】レーザー光等を照射しフォトマスク上の パターンを投影光学系によってシリコンウエハ等の半導 体基板上に投影解光するこの類の露光袋間における解光 方式としては、①密着(コンタクト)図光方式、②プロ キシミティ欧光方式、③反射型投影図光方式、⑤縮小レ ンズ投影蘇光方式の4方式が知られている。

【0003】このうち密着露光方式は、フォトマスク (または投影光学系) とウェハとを密着させて観光する もので、これらが完全に依着している場合には、フォト レジスト中の波長が風折率分の1に短くなるため、固折 の影響が少なく、高保豫度の転写が得られるという特色 を有している。しかし、完全な密菪を実現することは個 めて難しく、またフォトマスクとウエハとを機能的に接 触させているためにウエハ表面の突起等によりフォトマ スクに欠陥が生じ、その寿命を低下させると同時にデバ イスの歩留りに影響を及ばすといった問題があった。

【0004】そこで、密着露光方式によるこのような問 題を解決する方法としてフォトマスクとウエハ間に独体 (浸設)を充策している。 図2は投影光学系にウエハを 密着させた場合を示すもので、1はフォトマスク、2は 投影光学系の一部を構成する超光レンズ、3はフォトレ ジスト4が弦布されたウエハ、5は露光レンズ2とウエ ハ3間に充填された浸液、6はフォトマスク1のパター ン?を照射しフォトレジスト4を餌光する照射光、8は ウエハ3を保持する保持体、9は保持体8を上方に付勢 しウエハ3を露光レンズ2に押し付ける圧縮コイルばね 40 である。照射光6の波長は短いほど回折の影響が少な く、そのため光源としてエキシマレーザー等のレーザー 装置が用いられる。 浸液 5 としては、 屈折率がフォトレ ジスト4と同程度で光の吸収が少なく、しかもフォトレ ジスト4を溶かさないものが望ましく。 過常純水が使用 される。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述し たような浸被5を使用した密着型像光线層においては、

の吸収量にムラが生じるため、コンタクト爆発されたフ オトレジスト4のパターンが的確に低光されている部分 とそうでない部分とが生じてしまうという問題があっ た。したがって、このような露光ムラの発生を防止する ため、役被5の奠厚は1を薄くし、光の吸収ムラを少な くすることが望まれている。

【0006】本発明は上述したような従来の問題点およ び要望に鑑みてなされたもので、その目的とするところ は、浸液の膜厚を薄くし、露光ムラを軽減防止し得るよ うにした密着型隊光装置を提供することにある。

[0007]

【疎覆を祭決するための手段】本発明は上記目的を達成 するため、投影光学系もしくはフォトマスクのウエハ密 着面を親水化処理し、この親水化処理された密着面にフ ォトレジストを塗布されたウエハを浸液を介して密管さ せ、照射光の照射によりフォトマスクのパターンを前記 フォトレジストに転写するようにしたものである。

[8000]

【作用】本発明において、親水化処理された投影光学系 もしくはフォトマスクのウエハ密着画は、吸水性が向上 し、浸液の膜厚を薄くする。

[0009]

【実施例】以下、本発明を図面に示す実施例に基づいて 詳細に説明する。 図1は本発明に係る密着型型光装置の 一実施例を示す要部の断面図である。なお、図中図2と 同一緯成部品のものに対しては同一符号を以て示し、そ の説明を省略する。本実施例は投影光学系にウエハを密 着させた場合を示すもので、フォトマスク投影光学系の 一部を構成する露光レンズ2のウエハ密着面11を予め 30 親水化処理し、この親水化処理された密岩面11にウエ ハ3を施水等の浸液5を介して密着させ、照射光6の展 新によりフォトマスク 1のパターン 7をウエハ 3上に転 写するようにしたものである。

【0010】 販水化処理は、アルコール系等の競水溶液 で密着面11を奇麗に拭き、レンズ表面の汚れを取るこ とで行なわれる。そして、この親水化処理後密着面11 にウエハ3を浸液5を介して浴着させ、ウエハ3を露光 レンズ2にばね9により所定圧にて押しつける。

【0011】かくしてこのような構成においては、親水 化処理によって密着面 1 1 の吸水性を向上させているの で、親水化処理を施さなかったときと比較して浸液5の 吸水効果が大きく、したがって、浸液5の表面張力が小 さくなって濡れ性が上がるため、浸破5の膜厚は2 を図 2に示した従来装置と比較して薄くする (d2 <d1) ことができ、また膜原が謎くなれば光の吸収量も少なく なるので、これに比例して光の吸収ムラが波少し、脳光 ムラを軽減防止することができる。

[0012]

【発明の効果】以上説明したように本発明に係る密着型 浸液5自身の腹厚ムラがあると、浸液5による原射光6 50 露光装篋によれば、投影光学系またはフォトマスクのウ (3)

特開平4-305917

エハ密着面を親水化処理し、この親水化処理された密着 面に、フォトレジストを整布されたウエハを長波を介し て密着させるように構成したので、浸液自身の表面張力 を放らして濡れ性を向上させることができる。したがっ て、没被の順序を薄くするができ、また膜厚が薄くなれ ば侵骸の膜厚ムラも少なくなるため、光の吸収が少な く、疫液による観光ムラを軽減防止することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る密着型露光装置の一実施例を示す 要部の断面図である。

【図2】 密着型離光装配の従来例を示す妥略の耐面図で

ある.

【符号の説明】

- 1 フォトマスク
- 露光レンズ
- ウエハ
- フォトレジスト
- 5 浸液
- 照射光
- マスク
- 11 密着面 10

